Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	ler
10/616,345	ACKER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Laurie K. Cranmer	3636	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
297	216.13	, ,	MC	
017				
	<u></u>	/ /	1100	
280	730.2 X	9/27/05	MIC	
	728.1X			
	730.1×	:		
-				
<u> </u>				
				
	-			
•	· [1	(

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
				
	ТТ			

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·	
	-	
•		